

**ВПЛИВ ФЛУКТУАЦІЙ СПІН-ОРБІТАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ КВАНТОВОГО НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ДРОТУ**

Отримані вирази для часу релаксації, рухливості електронів і статичної електропровідності вздовж напівпровідникового квантового дроту, зумовлені одномірними гауссівськими флуктуаціями спін-орбітальної взаємодії електронів дроту. Для невиродженої статистики носіїв струму при низьких температурах ( $T$ ) рухливість електронів  $u_n \propto T^{-1/2}$ .

**Ключові слова:** квантовий напівпровідниковий дріт, одномірні гауссівські флуктуації, рухливість електронів, статична електропровідність.

Урахування впливу спін-орбітальної взаємодії є необхідним у багатьох проблемах фізики твердого тіла [1–3]. У зв'язку з досягненнями сучасних технологій актуальними стають дослідження низькорозмірних систем, в яких яскраво виявляються ефекти квантування електронного енергетичного спектра та спін-орбітальної взаємодії. Завдяки останнім народжується нова галузь твердотільної електроніки, названа “спінтронікою”, з якою пов'язують надії на створення нових електронних приладів і нових пристроїв для квантових обчислень на основі управління спіновим ступенем вільності носіїв заряду [4; 5]. Існуючі технології не виключають можливості впливу різноманітних флуктуацій у квазіодновимірних системах наноелектроніки. У [6] було досліджено вплив на статичну електропровідність випадкового поля, зумовленого флуктуаціями товщини квантового напівпровідникового дроту. Метою даної роботи є визначення впливу можливих одномірних гауссівських флуктуацій спін-орбітальної взаємодії на статичну електропровідність уздовж дроту.

Розглянемо модель квантового напівпровідникового дроту з поперечними розмірами, обмеженими за товщиною  $d$  (у напрямку координатної осі  $z$ ) одномірною потенціальною ямою  $V(z)$  з нескінченно високими стінками та за шириною (у напрямку  $y$ ) параболічним потенціалом  $\beta y^2$  ( $\beta > 0$ ). В одноелектронному наближенні [7] гамільтоніан системи має такий вигляд

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{U}_{so}, \tag{1}$$

де

$$\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + V(z) + \beta y^2 \tag{2}$$

– гамільтоніан незбуреної задачі,

$$V(z) = \begin{cases} 0, & -d/2 \leq z \leq d/2, \\ \infty, & z < -d/2, z > d/2, \end{cases} \tag{3}$$

$m$  – ефективна маса електрона провідності,

$$\hat{U}_{so} = [\gamma + \xi(x)][\hat{\sigma}_x \hat{p}_x (\hat{p}_y^2 - \hat{p}_z^2) + \hat{\sigma}_y \hat{p}_y (\hat{p}_z^2 - \hat{p}_x^2) + \hat{\sigma}_z \hat{p}_z (\hat{p}_x^2 - \hat{p}_y^2)] \tag{4}$$

– оператор спін-орбітальної взаємодії для об'ємного нецентроінверсного напівпровідника  $A_3B_5$  за механізмом Дрессельхауз [1, 4, 5] із врахуванням одномірної (уздовж осі дроту  $x$ ) випадкової флуктуації  $\xi(x)$ ,  $\hat{\sigma}_j$  ( $j = x, y, z$ ) – матриці Паулі,  $\hat{p}_j = -i\hbar(\partial/\partial x_j)$  – оператори складових імпульсу електрона. Спін-орбітальну взаємодію (4) вважаємо збуренням, що спричинює квантові переходи в трансляційному русі вздовж дроту зі зміною орієнтації спіну носія струму. Обмежимося внеском в електропровідність нижнього квантово-розмірного рівня енергії поперечного руху електрона. У наближенні врахування станів електрона з певною парністю по осі  $z$  хвильова функція незбуреної задачі має вигляд:

$$\Psi_{k_x, z}(\vec{r}) = \sqrt{\frac{2}{\pi^{1/2} L d y_0}} \exp\left(ik_x x - \frac{y^2}{2y_0^2}\right) \cos \frac{\pi}{d} z \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \tag{5}$$

де  $L$  – довжина дроту ( $L \gg d$ ),  $y_0 = \hbar^{1/2} (2m\beta)^{-1/4}$ . Енергія електрона в стані (5):

$$E(k_x) = \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m} + \frac{\pi^2 \hbar^2}{2md^2} + \hbar(\beta/2m)^{1/2}. \tag{6}$$

Обернений час релаксації електрона вздовж дроту з поворотом спіну

$$\frac{1}{\tau_n(k_x)} = \frac{2\pi}{\hbar} \sum_{k_x'} \langle\langle | \langle k'_{x,\downarrow} | \bar{U}_{10} | k_{x,\uparrow} \rangle |^2 \rangle\rangle \left( 1 - \frac{k_x'}{k_x} \right) \delta[E(k_x) - E(k_x')], \quad (7)$$

де подвійні дужки мають зміст усереднення за випадковою флуктуацією  $\xi(x)$ . Флуктуації  $\xi(x)$  будемо вважати гауссівськими:

$$\langle\langle \xi(x)\xi(x') \rangle\rangle = \Delta^2 \exp\left[-\frac{(x-x')^2}{2\Lambda^2}\right], \quad (8)$$

$$\langle\langle \xi(x) \rangle\rangle = 0.$$

Після обчислень (7) з урахуванням (4) і (8) знаходимо остаточний результат для часу релаксації:

$$\frac{1}{\tau_n(k_x)} = 2\sqrt{2\pi}\hbar^3 m \Delta^2 \Lambda \left( \frac{\pi^2}{d^2} - \frac{3}{2y_0^2} \right)^2 |k_x| \exp(-2\Lambda^2 k_x^2). \quad (9)$$

Для електронної провідності з кінетичного рівняння Больцмана в наближенні часу релаксації [7, 8] маємо:

$$\sigma_n = \frac{2\hbar^2 e^2}{m^2} \int_0^\infty \left( -\frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} \right) k_x^2 \tau_n(|k_x|) dk_x, \quad (10)$$

де  $f_0 = [\exp((\varepsilon_{k_x} - \mu)/k_B T) + 1]^{-1}$  – функція розподілу Фермі – Дірака,  $\varepsilon_{k_x} = (\hbar k_x)^2 / 2m$  – кінетична енергія руху електрона з ефективною масою  $m$  вздовж дроту,  $\mu$  – хімічний потенціал, відрахований від квантово-розмірного рівня руху електрона поперек дроту;  $2 \sum_{k_x} f_0(k_x) = N$  – повна кількість електронів дроту,  $e$  – абсолютна величина заряду електрона.

Після підстановки (9) у (10) і проведення розрахунку за допомогою [9] отримуємо:

$$\sigma_n = \frac{e^2}{\hbar^3 m^2 \Delta^2 \Lambda} \left( \frac{\pi^2}{d^2} - \frac{3}{2y_0^2} \right)^{-2} \frac{\exp(\mu/k_B T)}{\sqrt{2\pi}(1-\beta)} \times$$

$$\times F(2, 1-\beta; 2-\beta; -\exp(\mu/k_B T)), \quad (11)$$

$$\beta = (4m\Lambda^2 k_B T / \hbar^2). \quad (12)$$

$F$  – гіпергеометричний ряд [9, 10]. Формули (11), (12) дійсні при  $\beta < 1$ , що пов'язано з тим, що час релаксації (9) експоненціально зростає з енергією електрона. Тому для ефективного розсіяння на гауссівських флуктуаціях важливим є те, щоб “теплова” довжина хвилі де Бройля носія заряду перевищувала величину кореляційного радіуса  $\Lambda$ . Ще одне обмеження пов'язане з вибором нескінченної верхньої межі в інтегралі (10), коли  $[(\hbar^2 / 2mk_B T) - 2\Lambda^2](\pi/\ell)^2 \gg 1$ , де  $\ell$  – стала ґратки вздовж осі дроту.

Використовуючи відомі властивості гіпергеометричного ряду [9, 10], з (11), (12) можна визначити рухливість електрона  $u_n$  вздовж осі дроту з поворотом спіну для різних граничних випадків. Для невідродженої статистики носіїв струму

$$u_n = \frac{e \left( \frac{\pi^2}{d^2} - \frac{3}{2y_0^2} \right)^{-2} (1-\beta)^{-1}}{2\hbar^2 m^{5/2} \Delta^2 \Lambda (k_B T)^{1/2}}, \quad (13)$$

якщо в низькотемпературній ділянці невідродженого дроту  $u_n \propto T^{-1/2}$ . За температурною залежністю рухливості це нагадує п'єзоелектричне розсіяння на акустичних фонах [11] для тривимірних напівпровідникових матеріалів.

Для виродженого дроту в граничному випадку низьких температур, коли  $(k_B T / \mu) \ll 1$ , електропровідність уздовж осі дроту:

$$\sigma_n \approx \frac{e^2 \left( \frac{\pi^2}{d^2} - \frac{3}{2y_0^2} \right)^{-2}}{\sqrt{2\pi\hbar^3 m^2 \Delta^2 \Lambda}} \exp(4\pi\mu\Lambda^2 / \hbar^2). \quad (14)$$

Температурна залежність  $\sigma_n$  визначається хімічним потенціалом одновимірного електронного газу:

$$\mu(T) \approx \mu_0 \left[ 1 + \frac{\pi^2}{12} \left( \frac{k_B T}{\mu_0} \right)^2 \right], \quad (15)$$

$$\mu_0 = \frac{\hbar^2}{8m} (\pi n)^2, \quad (16)$$

де  $n = N/L$  – кількість електронів на одиниці довжини дроту.

Зауважимо, що отримані температурні залежності статичної електропровідності вздовж напівпровідникового квантового дроту при розсіянні з поворотом спіну електрона внаслідок одновимірних гауссівських флуктуацій спін-орбітальної взаємодії суттєво відрізняються від випадку розсіяння без зміни орієнтації спіну, зумовленого випадковим полем гауссівських флуктуацій товщини [6] дроту.

1. Dresselhaus G. Spin-orbit coupling effects in Zinc Blende structures // Phys. Rev. – 1955. – V.100. – №2. – P.580–586.
2. Рашба Э.И. Свойства полупроводников с петлей экстремумов // ФТТ. – 1960. – Т.2. – №6. – С.1224–1237.
3. Возняк О.М. Врахування впливу спін-орбітальної взаємодії на енергетичний спектр ідеальних кристалів та неупорядкованих твердих тіл у методі сильного зв'язку // Фізика і хімія твердого тіла. – 2005. – Т.6. – №3. – С.351–361.
4. Магарилл Л.И., Чаплик А.В. Спин-зависимая локализация электронов в кристаллах // Письма в ЖЭТФ. – 2005. – Т.81. – №4. – С.198–202.
5. Efros Al.L., Rashba E.I. Theory of electric dipole spin resonance in a parabolic quantum well // Phys. Rev. – 2006. – V.73. – P.165325-1–165325-19.
6. Рувинский М.А., Рувинский Б.М. О влиянии флуктуаций толщины на статическую электропроводность квантовой полупроводниковой проволоки // ФТП. – 2005. – Т.39. – №2. – С.247–250.
7. Ансельм А.И. Введение в теорию полупроводников. – М.: Наука, 1978. – 616 с.
8. Гантмахер В.Ф., Левинсон И.Б. Рассеяние носителей тока в металлах и полупроводниках. – М.: Наука, 1984. – 352 с.
9. Прудников А.П., Брычков Ю.А., Маричев А.И. Интегралы и ряды. Элементарные функции. – М.: Наука, 1981. – 800 с.
10. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Квантовая механика. Нерелятивистская теория. – М.: Наука, 1974. – 752 с.
11. Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С.Г. Физика полупроводников. – М.: Наука, 1977. – 672 с.

*The expressions for a relaxation time, an electron mobility and static electroconductivity along a semiconductor quantum wire conditioned by one-dimensional Gaussian fluctuations of spin-orbital interaction wire electrons are obtained. For nondegenerate statistics of carriers at low temperatures statistics of carriers at low temperatures (T) the electron mobility  $u_n \propto T^{-1/2}$ .*

**Key words:** quantum semiconductor wire, one-dimensional Gaussian fluctuations, electron mobility, static electroconductivity.

УДК 621.315.592

ББК 22.379.23

О.М. Возняк, Л.І. Никируй, О.І. Льків

### ВАРІАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗГЛЯДУ ЯВИЩ ПЕРЕНОСУ В НАПІВПРОВІДНИКАХ НА ОСНОВІ КІНЕТИЧНОГО РІВНЯННЯ БОЛЬЦМАНА (I)

*Розглянуто загальний підхід до опису нерівноважних процесів у напівпровідниках. Зроблено аналіз варіаційного підходу до розгляду явищ переносу на основі кінетичного рівняння Больцмана. Наведено матричні елементи оператора зіткнень для різних механізмів розсіювання.*

**Ключові слова:** явища переносу, кінетичне рівняння Больцмана, варіаційний метод, рухливість носіїв.